

第二届半导体辐射探测器研讨会暨国际高层论坛 Second Workshop of Semiconductor Radiation Detectors and International High Level Forum

Tuesday, 14 August 2018

辐射诱发CCD探测器性能退化试验与损伤机理研究 王祖军 - 15楼博观厅 (08:30 - 08:50)

-Conveners: 祖军 王